



입자 빔 질량 분광 광도계

특허등록번호

10-1401742

특허명

분리형 입자 집속 유닛을 가지는 입자
복합특성 측정장치

대표발명자

대외협력실 강상우



반도체 소자 초미세 나노입자의 특성을 실시간으로 분석

입자 빔 질량 분광 광도계

머리카락 굵기의 10만분의 1에 달하는 초미세 나노입자의 특성을 실시간으로 분석하는 기술



우리나라 표준과학 분야를 선도하는 KRISS의 나노입자 진단기술을 통해 실시간으로 반도체와 디스플레이 소자로 쓰이는 나노미터 크기 입자의 오염 여부를 진단해보세요!

'입자 빔 질량 분광 광도계' 기술은 머리카락 굵기의 10만분의 1에 달하는 초미세 나노입자의 특성을 실시간으로 분석하는 기술입니다. 비교적 저렴한 비용으로 장치 시스템을 구성할 수 있고 밸브 유닛을 이용하여 환경 조건에 최적화된 펌프 용량을 연결 할 수 있어 오염입자의 관리를 철저히 해 제품의 불량률을 현저히 떨어트려줄 것으로 기대를 모으고 있습니다.

기술사업화의 산업, 경제적 효과가 수천억으로 예측되는 KRISS 연구팀 개발의 이 놀라운 반도체 제품 불량 감지 기술입니다.